

# ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会

略称:TSC(ナノエレ分析研究会)

～半導体/ナノエレ計測・分析技術の研究者・技術者が交流する場～

SATテクノロジー・ショーケース2013

## ■ はじめに

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(略称TSC※)は、ナノエレクトロニクス分野における計測・分析技術のニーズを発掘するとともに、シーズとしての計測・分析技術の最新情報の共有化を目的とする、産業技術総合研究所に設けられたコンソーシアムです。

## ■ 活動内容

### 1. Web ページ「TSC計測分析技術交流広場」(無料サイト)の運営

先端分析技術に関してオープンに討議する場を提供し産学独の連携をベースに日本の技術力アップに寄与することを目的としたホームページです。計測分析技術について日頃、疑問に思っていることや抱えている課題について調べたり、関係者と自由に質問討議したりすることができます。分析初心者から分析上級者まで計測・分析に興味のあるすべてのエンジニア、研究者、学生を対象としています。

#### ◇HP内容

- ・計測分析技術に関する疑問、活用方法や応用技術を議論する掲示板
- ・計測技術一覧  
計測技術に関して簡単に説明するとともに、各用語をクリックすると、より詳細な解説を読むことができます。
- ・分析サロン  
「計測分析技術掲示板」への投稿内容を参考に、計測分析技術をピックアップし、各界の第一人者に、原理から最新の応用まで、わかりやすく解説して頂きます。

この他にも、内容盛りだくさんです。是非、Web ページを訪問してみてください。

URL: <http://www.tsc-web.jp/tsc/>

※TSC: Tsukuba Society of Characterization and Analysis for Nanoelectronics

「TSC, 分析」で検索して下さい!!

## 2. 計測分析セミナーの開催

会員向けの計測分析技術に関するセミナーを開催しています。セミナーのテーマは、会員の方々の希望に合わせて選んでおります。本年度は、7月にヘリウムイオン顕微鏡のセミナー・見学会を開催しました。

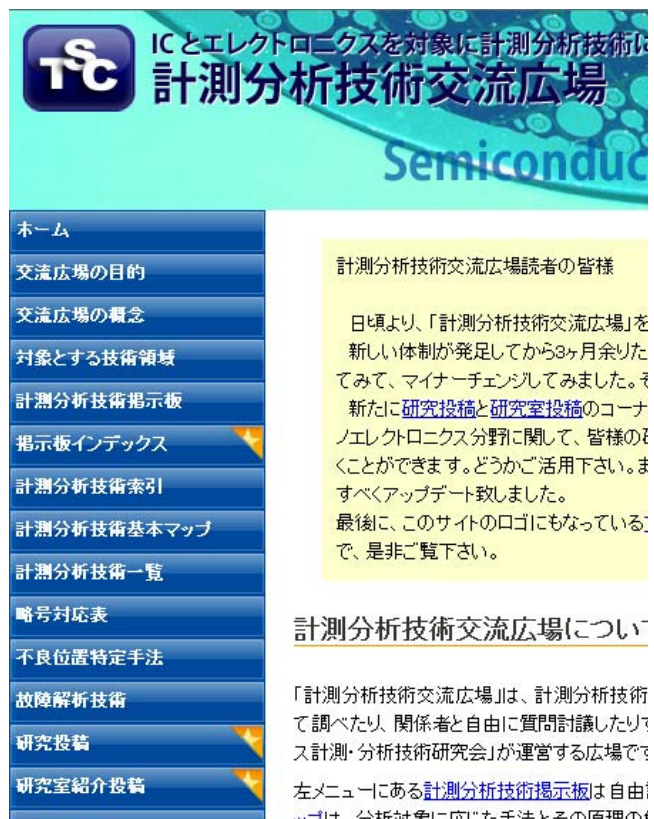
この他にも、計測・分析技術のニーズ/シーズを発掘すべく活動範囲を広げていく予定です。

現在会員は、富士通研、パナソニック、ルネサスエレクトロニクス、産総研、三洋半導体、JFEテクノロジー、東芝(アルファベット順)となっています。半導体メーカー・分析会社を初め様々な企業の参加も歓迎致しますので、興味ある方は、

[tsc-web@semiconportal.com](mailto:tsc-web@semiconportal.com)

まで、お問い合わせ下さい。

### ホームページ表紙



The screenshot shows the homepage of the TSC (Tsukuba Society of Characterization and Analysis for Nanoelectronics) website. The header features the TSC logo and the text "ICとエレクトロニクスを対象に計測分析技術の計測分析技術交流広場 Semiconduc". A navigation menu on the left lists various sections: ホーム, 交流広場の目的, 交流広場の概念, 対象とする技術領域, 計測分析技術掲示板, 掲示板インデックス, 計測分析技術索引, 計測分析技術基本マップ, 計測分析技術一覧, 略号対応表, 不良位置特定手法, 故障解析技術, 研究投稿, and 研究室紹介投稿. A main content area on the right contains a message from the site administrators, dated July, regarding updates to the site's structure and the addition of new features like "Research Postings" and "Research Room Postings". Below this, there is a section titled "計測分析技術交流広場について" (About the TSC Exchange Field) which describes the site's purpose as a platform for discussion and information exchange among researchers and engineers in the field of measurement and analysis technology.

代表発表者 多田 哲也 (ただ てつや)  
所 属 (独)産業技術総合研究所  
ナノエレクトロニクス研究部門/ナノデバイス  
センター

問合せ先 〒305-8562 つくば市東1-1-1  
TEL:029-861-2628 FAX:029-861-2576

■キーワード: (1)計測・分析技術  
(2)半導体デバイス  
(3)ナノエレクトロニクス